

1-2 欠け／缺口／Nicks

1-2-1 異物起因（欠け）／杂物起因（缺口）／Caused by foreign objects(nicks)

1-2-1-1 単独異形欠け／异型的单独缺口／Isolated nick by foreign object

【特徴】形状がシャープで、異物の形状酷似の単独欠け

【特征】轮廓清晰，酷似杂物的形状的单独缺口。

【Characteristics】Isolated and well defined nick which looks very much like the shape of a foreign object.

【原因・判断ポイント・発生工程】導体幅より大きく、導体幅＋導体間隔より小さい、不透明で片状の異物が、DFRより上に介在し、回路露光時に露光を遮ったことにより出来たもの（露光焼付～ET工程）

【原因、判断要点、发生工序】在DFR上夹杂着比线宽大、比线宽＋线距小的不透明的片状杂物，妨碍曝光而引起的（曝光～ET工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】Exposure light is blocked off by an opaque and thin foreign object larger than the conductor width and smaller than (conductor width + conductor spacing) above dry film to cause this defect. (Exposure - etching process)



【コメント】
顕微鏡倍率×100

【注釋】
显微镜倍率 ×100

【Comments】
Magnification: ×100



【コメント】
顕微鏡倍率×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率×70

【注釋】
显微镜倍率 ×70

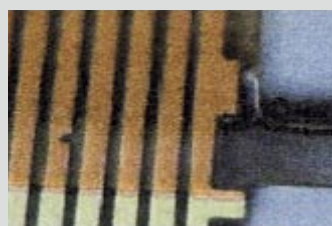
【Comments】
Magnification: ×70



【コメント】
顕微鏡倍率×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
FPC
顕微鏡倍率×100

【注釋】
FPC
显微镜倍率 ×100

【Comments】
FPC
Magnification: ×100